

装置の概要

【型式等】

- 装置名称：エックス線光電子分光装置
- メーカー：サーモフィッシャーサイエンティフィック（株）
- 型式：K-Alpha

【仕様】

- エックス線源：Al K α 線
- マイクロフォーカスマノクロメーター：50~400 μ m
- 測定モード：光電子スペクトル、深さ方向、マッピング



※本装置は（公財）JKAの補助事業（機械工業振興補助事業）により導入されました。

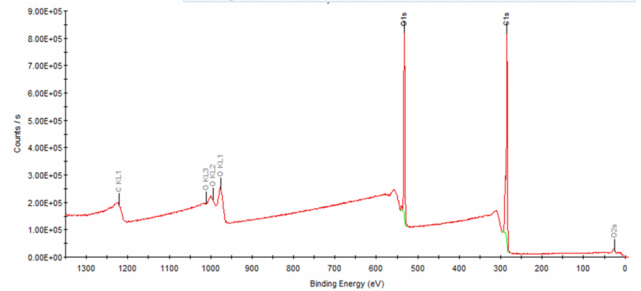
極表面の元素組成、化学結合状態評価が行えます！

【装置の特徴】

サーベイスペクトル測定、任意の元素を指定しての高分解能ナローズペクトル測定、深さ方向分析、角度分解分析、マッピング測定が可能なマイクロフォーカスタイプのXPSシステムです。

本システムでは、半導体、金属合金、セラミックス、ガラス、ポリマー、磁性材料及び絶縁体の固体、粉末又は薄膜試料の極表面の元素組成、化学結合状態を自動分析することが可能です。

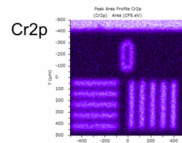
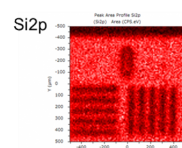
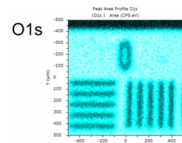
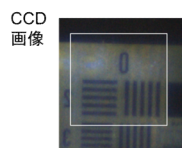
Name	Peak BE	Height CPS	FWHM eV	Area (P) CPS.eV	Atomic %
Al2p3 Metal	72.7	16772.7	0.6	11614.0	5.3
Al2p1 Metal	73.1	8386.4	0.6	5807.0	0.0
Al2p AlOx	75.9	47277.4	1.7	92603.2	28.3
C1s	286.7	24692.8	1.7	59708.7	11.6
O1s	533.0	242931.6	2.6	682778.6	54.7
Mg1s	1305.9	2082.7	1.7	4054.6	0.2



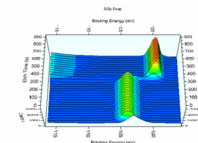
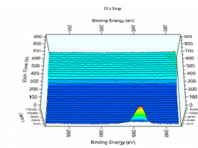
サーベイスペクトル (Alホール)

【主な用途】

- 表面汚染物質の解析
- 機能性薄膜の構造評価
- 表面劣化、改質性の評価
etc...



マッピング (Crメッキ/SiO₂)



深さ方向分析 (シリコン酸化膜)

料金・問い合わせ先

	区分	単位	料金(円)
設備使用	エックス線光電子分光装置 (K-Alpha)	1時間ごと	14,580
依頼試験	分析-表面分析-エックス線光電子分光分析-定性分析	1試料1分析点につき	25,140

〒963-0297

郡山市待池台1丁目12番地

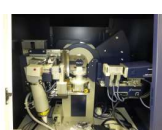
TEL : 024-959-1738 (分析・化学科)

FAX : 024-959-1761

併せて使うと効果的です！



水平型エックス線回折装置
(6,460円/時間)



ナノスケール物性測定システム
(7,030円/時間)